

IO-0009-01 | Microscopio de medición multifuncional

El microscopio de medición multifuncional ha sido desarrollado para la industria de semiconductores, electrónica y metalúrgica. Como avanzado microscopio metalúrgico, se emplea para identificar y analizar la estructura de diversos metales y aleaciones. También se emplea en industrias, laboratorios, centros de investigación para analizar la calidad de los metales fundidos, materiales y estructura metalúrgica después de su tratamiento. Tiene un diseño ergonómico para su uso de manera cómoda.

Principales características

Campo de visión brillante y amplio que permite una imagen clara y estable.

Alta resolución, amplia distancia focal y gran alcance de luz

Objetivo de gran tecnología para observación con luz brillante o poca luz, con filtro polarizador para obtener una imagen clara y transparente.

Iluminación Kohler de superficies esféricas para aumentar el brillo.



Especificaciones técnicas

Cabezal de observación	Ajuste en ángulo de 0 a 45° con distancia interpupilar de 50 a 75 mm
Ocular	WF 10/25 mm (WF 15 X, WF 20 X a opción) WF 10 X / 20 mm, hilo vertical con retícula de 0,1 mm
Objetivo	Distancia de trabajo infinita con objetivos apocromáticos 5×/0.15 W.D. 44mm 10×/0.30 W.D. 34mm 20×/0.35 W.D. 30mm 40×/0.35 W.D. 30mm
Montura nasal	Cuádruple con centro regulable
Iluminación de perfil	Fuente de luz de bulbo halógeno de 12 V, 50 W Sistema óptico mediante sistema de luz telecéntrico con apertura regulable Intensidad y brillo de luz regulable
Iluminación de superficie	Fuente de luz halógena de 12 V, 50 W Sistema óptico por iluminación Hohler con diafragma de iris de apertura y diafragma de iris de campo Intensidad y brillo de luz regulables
Dispositivo de polarización	Analizador rotatorio de 360°. Tanto el polarizador como el analizador pueden alejarse del haz de luz
Dispositivo de visualización	Número de ejes: 2 ó 3 ejes Resolución: 0,001 mm / 0,005 mm / 0,0005 mm Funciones: Puesta en cero, cambio de dirección, salida de datos, señal TTL Fuente eléctrica: 85 - 230 VCA
Herramienta de verificación	Micrómetro de 0,01 mm

Area de desplazamiento X-Y: 100 x 100 mm
Distancia de desplazamiento eje Z: 150 mm
Método de enfoque: Manual
Medición:
3 ejes: X,Y, Z
2 ejes: X, Y
Resolución: 0,001 mm, 0,05 mm, 0,0005
Ambiente de funcionamiento: 20°C (+/- 1°C)
Función de flotación: Los ejes X e Y pueden desconectarse rapidamente
Área de los ejes X-Y: 286 mm x 286 mm
Área efectiva de medición: 180 mm x 180 mm

Accesorios opcionales

Software de medición bidimensional
Ocular micrométrico
Ocular digital de 5 MB
Accesorio para fotografía y adaptador de CCD de 0,5 X, 0,57 X y 0,75 X
Objetivos para largas distancias de trabajo: 2X, 100X
Cámara CCD en colores de 1/3" con resolución de 520 líneas
Valor de división angular

otros productos

Microscopio digital



Microscopio estereoscópico



Microscopio de bolsillo

